

Rentgenová difrakce – analýza krystalické struktury vzorku

F8544 Experimentální metody 2

Braggova difrakční podmínka l

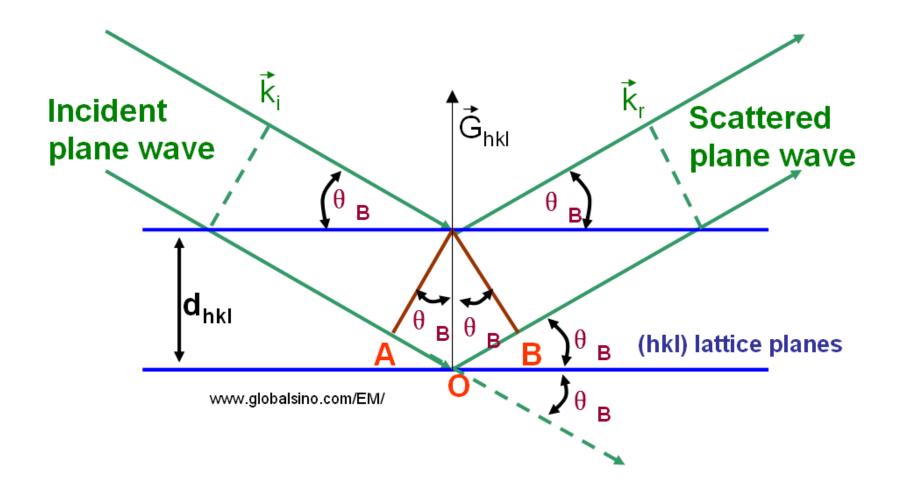
- Monochromatické záření dopadá na polykrystalický vzorek + zrna jsou tak malá, že v ozářeném objemu jsou zastoupeny všechny orientace zrn.
- Difraktují zrna, pro něž je splněna difrakční Braggova podmínka (pro krystaly kubické syngonie)

$$2a\sin\theta = \lambda\sqrt{h^2 + k^2 + l^2},\tag{1}$$

kde λ je vlnová délka záření, a je mřížkový parametr a h, k, l jsou Laueho indexy. Ty vzniknou vynásobením Millerových indexů h_0 , k_0 , l_0 roviny přirozeným číslem n, které je řádem difrakce.



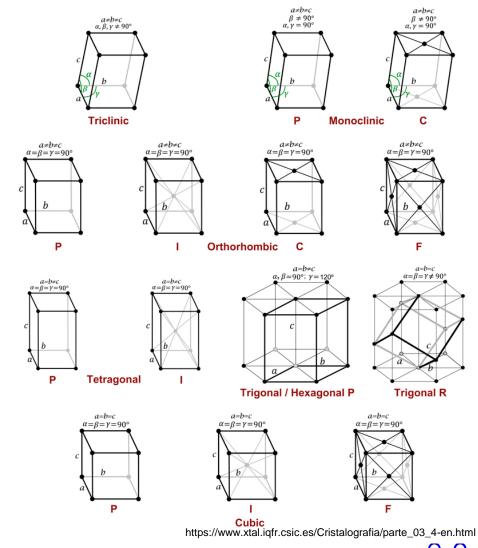
Braggova difrakční podmínka II





Povolené/zakázané difrakce l

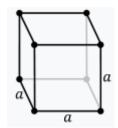
- Intenzita difrakce je dána strukturním faktorem, který závisí na struktuře elementární buňky.
- V různých translačních typech Bravaisovy mřížky existují Laueho indexy, pro něž je intenzita difrakce nulová (zakázané difrakce). V těchto difrakcích se vlny rozptýlené jednotlivými atomy v elementární buňce ruší.



Povolené/zakázané difrakce – kubická mřížka

Prostá

všechny difrakce jsou povoleny



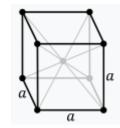
Plošně centrovaná

Laueho indexy mají stejnou

paritu

Prostorově centrovaná

h + k + l je sudé



Diamantová

Liché Laueho indexy, nebo sudé Laueho indexy, jejichž součet je dělitelný 4



Velikost krystalitů – Scherrerova rovnice

Pro nejjednodušší výpočet velikosti krystalitů se využívá Scherrerovy rovnice. Je to poloempirická rovnice dávají do souvislosti pološířku difrakčního píku s velikostí krystalitů za předpokladu, že píky jsou rozšířeny jen kvůli malé velikosti krystalitů.

 $\tau = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \,, \tag{2}$

kde τ je velikost krystalitů, K je empirický faktor udávající tvar krystalitů (typicky 0,94), β je pološířka (FWHM) píku a θ je úhel udávající pozici píku. Úhel a pološířka jsou v radiánech.

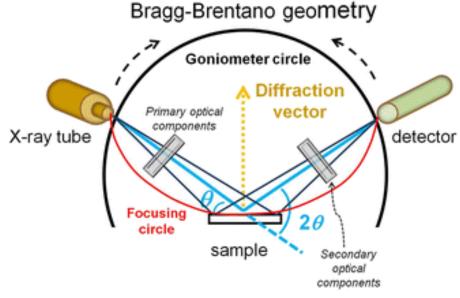


Měření



Bragg-Brentanova konfigurace

- Měření se provádí v Bragg-Brentanově konfiguraci – samofokusující konfigurace.
- vzdálenosti zdroj–střed goniometru a střed goniometru-detektor stejné, a zároveň je úhel dopadu středního paprsku na vzorek roven úhlu výstupu středního paprsku ze vzorku do detektoru.

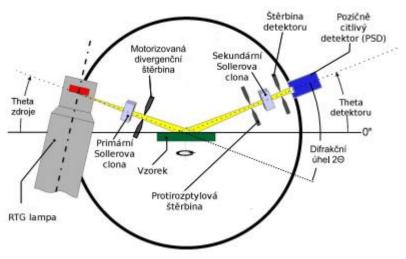


https://link.springer.com/article/10.1007/s40828-016-0033-5



Měřící konfigurace

- Cu rentgenka -v měřícím svazku pak dominuje záření vlnových délek 1,540601 Å a 1,544430 Å (Cu K_{α1} a K_{α2})
- Sollerovy clony vymezují úhlovou aperturu ve směru kolmém na rozptylovou rovinu a motorizovaná štěrbina ve směru podélném
- Pozičně citlivý (1D) detektor



https://www.physics.muni.cz/ufkl/Vyuka/Praktika/F6390-PraktikumFPL-Navody-2018.pdf



Měření I - přístroj

- Před samotným měřením je potřeba přístroj najustovat, což se děje automaticky
- Při měření práškového vzorku bude využito měřícího rozsahu 20-100° s krokem 0,01°
- data budou uložena na počítači první sloupec odpovídá difrakčnímu úhlu 2θ, druhý měřené intenzitě, třetí absorpčnímu faktoru (typicky konstantní).



Měření II - zpracování

- V naměřených datech nafitujte 5 nejvýraznějších píků. Odečtěte 2θ polohy maxim difrakčních čar (pozor, difrakční čáry jsou při vyšších úhlech 2θ rozštěpeny) a pološířky píků.
- Pomocí databáze jako je http://www.crystallography.net/cod/ identifikujte tyto píky a určete typ přítomné mřížky vzorku – ověřte splnění předpodkladů pro povolené difrakce. Pomocí rovnice (1) určete velikost mřížového parametru a pomocí rovnice (2) velikost krystalitů ze všech 5 fitovaných píků.

